

# DIN 50451-5:2010-03 (D)

**Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Bestimmung von Elementspuren in Flüssigkeiten - Teil 5: Leitlinie zur Auswahl von Werkstoffen und Prüfung ihrer Eignung für Geräte zur Probenahme und Probenvorbereitung für die Elementspuren-Bestimmung im Bereich von Mikrogramm je Kilogramm und Nanogramm je Kilogramm**

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>5</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>6</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>7</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>7</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>7</b>
<b>4 Werkstoffeinfluss der Geräte und Hilfsmittel auf die Proben</b> .....	<b>7</b>
<b>4.1 Allgemeines</b> .....	<b>7</b>
<b>4.2 Kunststoffe</b> .....	<b>8</b>
<b>4.3 Kieselglas</b> .....	<b>8</b>
<b>5 Kriterien für die Auswahl geeigneter Gerätewerkstoffe</b> .....	<b>8</b>
<b>6 Eignungsprüfung</b> .....	<b>11</b>
<b>6.1 Reagenzien</b> .....	<b>11</b>
<b>6.2 Reinigung der Probenahme- und Probenvorbereitungsgefäße</b> .....	<b>11</b>
<b>6.3 Durchführung</b> .....	<b>11</b>
<b>6.4 Angabe der Ergebnisse</b> .....	<b>12</b>
<b>6.5 Prüfbericht</b> .....	<b>12</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>13</b>
<b>Tabellen</b>	
<b>Tabelle 1 — Beständigkeit von Gerätewerkstoffen gegenüber unterschiedlichen Klassen chemischer Substanzen</b> .....	<b>10</b>